

2018年度「ぶんせき講習会」(実践編)

第65回機器による分析化学講習会

～基礎から学ぶSEM及びXRFによる材料の微小領域分析～

主催 (公社) 日本分析化学会近畿支部, 近畿分析技術研究懇話会
協賛 (公社) 化学工学会関西支部, (一社) 近畿化学協会, (公社) 日本化学会近畿支部
(公社) 有機合成化学協会関西支部, 関西分析研究会

走査型電子顕微鏡(SEM)及び蛍光 X 線分析装置 (XRF) はエレクトロニクス, 環境, エネルギー, 医療などさまざまな分野における材料分析に広く利用されています。近年, 材料の機能化の必要性から, 材料の複合化や微小化が進み, 材料表面の形態, 化学状分析, マッピングによる物質の分布解析の重要性が大きく増大しています。本講習では SEM 及び XRF 分析の基礎と実例について, 講義と実習を通して学んでいただきます。SEM 及び XRF 分析を行う際の測定条件設定のポイントや解析方法を修得できます。

日時 2018年7月13日(金) 9:50～17:00(受付 9:30～)

場所 日本電子株式会社 (JEOL) 西日本ソリューションセンター

[大阪市淀川区西中島 5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 1 階, TEL: 06-6305-0105]

<交通> JR 新大阪駅 中央口 徒歩 5 分

地下鉄御堂筋線 新大阪駅南口 (7 番出口) 徒歩 2 分

【講習プログラム】

1. 講義「SEM 及び XRF の基礎」(9:50～11:00)

日本電子株式会社 藤田 憲市 氏

2. 講義「FE-SEM および EDS を用いた電池材料解析」(11:10～11:50)

奈良工業高等専門学校 山田 裕久 氏

3. 講義「卓上型蛍光 X 線分析装置の紹介と適用例」(11:50～12:30)

大阪市立大学大学院工学研究科 辻 幸一 氏

4. 実習(13:45～16:45)

日本電子株式会社 藤田 憲市 氏

実習項目 ・SEM のための試料前処理方法, 微小領域分析

・SEM-EDS による元素分析とマッピング

・XRF による元素分析

5. 質疑応答(16:45～17:00)

*参加者には事前に電子メールにて PDF 資料を送付します。

*当日のテキストについては, 各自でPDFを印刷しての持参, あるいはタブレット等での準備をお願いします。講義1のテキストについてのみ, 当日, 配布します。

*ご昼食は用意しません。会場周辺の飲食店等をご利用ください。

*同業者のお申込みの場合には, ご遠慮していただく場合がありますことをご了解ください。

参加費 主催・協賛団体所属会員 10,000 円, 学生 5,000 円, 会員外 20,000 円

定員 30 名 (先着順申込受付とし, 定員になり次第締切)

申込方法 参加を希望される方は, 近畿支部 HP (<http://www.bunkin.org/>) から本講習会のページに入ってください, 【参加申込フォーム】にて Web からお申し込みください。

お申込み後, 自動返信メールが届きましたら, 開催日前日までに参加費のお支払いをお願い致します。参加費は銀行口座(りそな銀行御堂筋支店 普通預金 No.2340726, 名義公益社団法人日本分析化学会近畿支部)にお振り込みください。

*参加証と会場案内図・テキストダウンロード情報などをメールにて送付します。

当日, この参加証を持参してください。

*参加決定者には団体傷害保険に加入していただきます。保険料は参加費に含まれます。

申込期限 2018年7月5日(木) (7月6日以降のキャンセルは不可)

申込先 公益社団法人 日本分析化学会近畿支部

〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-8-4 大阪科学技術センター6 階

TEL: 06-6441-5531 / FAX: 06-6443-6685 / E-mail: mail@bunkin.org

問い合わせ先 川崎 英也 (関西大学) E-mail: hkawa@kansai-u.ac.jp

「発展編 ～全内部反射顕微分光計測法の基礎と応用～」を 11/30 (金), 於: 大阪大学, 予定しています。